

## **АННОТАЦИЯ**

к рабочей программе дисциплины  
«Метрология, стандартизация и технические измерения»

**Направление подготовки 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника**

**Профиль** Компоненты микро- и наносистемной техники

**Квалификация выпускника** бакалавр

**Нормативный период обучения** 4 года

**Форма обучения** очная

**Год начала подготовки** 2022

**Цель изучения дисциплины:** получение студентами основных научно-практических знаний в области метрологии и стандартизации, необходимых для решения задач обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологического и нормативного обеспечения разработки, производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции, планирования и выполнения работ по стандартизации продукции и процессов разработки и внедрения систем управления качеством; метрологической и нормативной экспертиз.

**Задачи изучения дисциплины:** дать представление о современных направлениях развития метрологии и измерительной техники; ознакомить обучающихся с основными метрологическими характеристиками средств измерений и методами обработки экспериментальных результатов; научить студентов анализировать причины возникновения погрешностей измерений, освоить методы вычисления погрешностей; дать основные представления о приборах для измерения электрических и неэлектрических величин.

**Перечень формируемых компетенций:**

ОПК-3 - Способен проводить измерения и наблюдения, обрабатывать и представлять экспериментальные данные.

ОПК-6 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью на основе применения стандартов, норм и правил.

**Общая трудоемкость дисциплины:** 5 зачетных единиц

**Форма итогового контроля по дисциплине:** Экзамен